

한국표면공학회지 J. Kor. Inst. Surf. Eng. Vol. 43, No. 5, 2010. <연구논문>

하이브리드 코팅시스템에 의한 Cr-Si-O-N 코팅막 합성 및 기계적 성질

이정두^a, 왕치민^b, 김광호^{a,b*}

[®]부산대학교 재료공학과, ^b부산대학교 하이브리드 소재 솔루션 국가핵심연구센터

Syntheses and Mechanical Properties of Quaternary Cr-Si-O-N Coatings by Hybrid Coating System

Jeong Doo Lee^a, Qi Min Wang^b, Kwang Ho Kim^{a,b*}

^aSchool of Materials Science and Engineering, Pusan National University, Busan 609-735, Korea ^bNational Core Research Center for Hybrid Materials Solution, Busan National University, Busan 609-735, Korea

(Received September 9, 2010; revised October 21, 2010; accepted October 30, 2010)

Abstract

In the present work, the influence of oxide on the Cr-Si-N coatings was investigated for the Cr-Si-O-N coatings on AISI 304 and Si wafer deposited by hybrid system, which combines the DC magnetron sputtering technique and arc ion plating (AIP) using Cr and Si target in an $Ar/N_2/O_2$ gaseous mixture. As the O content in the Cr-Si-N coatings increased, the diffraction patterns of the Cr-Si-O-N coatings showed CrN and Cr_2O_3 phases. However, as the O content increased to 28.8 at.%, diffraction peak of Cr_2O_3 was disappeared in the Cr-Si-O-N coating. The d_{200} value was decreased with increasing of O content. The average grain size increased from about 40 nm to 65 nm as the O content increased. The maximum micro-hardness of the Cr-Si-O-N coating was obtained 4507 Hk at the O content of 24.8 at.%. The average friction coefficient of the Cr-Si-O-N coatings was gradually decreased by increasing the O content and the average friction coefficient decreased from 0.37 to 0.25 by increasing the O content.

Keywords: Influence of oxide, Cr-Si-O-N, Hybrid system, Micro-hardness, Cr₂O₃, Average friction coefficient, Amorphous

1. 서 론

CrN 박막은 뛰어난 내마모성과 내부식성, 내산화 성에 의해 공구 및 장치의 수명향상을 위한 보호막 으로 사용되고 있다¹⁻⁵⁾. 최근 CrN 박막보다 경도, 내산화, 내마모성이 뛰어난 3성분계 Cr-X-N박막에 대한 연구가 계속 진행되고 있다(X=Al, Si, Ti, C, Mo 등)⁶⁻¹²⁾. Cr-Si-N 박막은 CrN 박막보다 기계적 성질이 뛰어나고 특히 높은 경도 값을 가진다. 이 는 (Cr,Si)N 결정질과 Si₃N₄ 비정질로 구성된 나노 복합체 구조에서 기인한 것으로 보고되고 있다. Cr-

*Corresponding author. E-mail : kwhokim@pusan.ac.kr

Si-N 박막에서 Si 함량이 증가하면 박막의 평균 마 찰계수 값이 작아지는데 이는 대기중위 수분과 산 소가 Si₃N₄와 화학적으로 반응하여 자기윤활막 역 할을 하는 SiO₂, Si(OH)₂ 등의 화합물이 형성되기 때문이다.

최근 산소를 첨가한 박막이 많이 연구되고 있고 TiN 박막에 산소가 첨가되면 구조가 변하고 미세 경도 값이 증가한다.¹³⁾ 그리고 CrN 박막에 산소가 첨가되면 치밀하고 안정한 Cr₂O₃ 상이 형성되고 Cr₂O₃는 고온 내산화성과 뛰어난 기계적 성질을 가 지는 것으로 보고되고 있다. 또한 산소가 첨가된 CrN 박막은 기존의 CrN 박막보다 높은 경도와 낮 은 마찰계수를 가지는 것으로 보고되고 있다.¹⁴⁻¹⁶⁾ 본 논문에서는 4성분계 Cr-Si-O-N 박막을 아크 이온 플레이팅(AIP; arc ion plating)과 스퍼터링 (sputtering)법을 혼합한 하이브리드 코팅 시스템 (Hybrid Coating System)을 사용하여 합성하였다. Cr-Si-O-N 박막은 AISI 304 기판과 Si 웨이퍼에 증 착시키고 산소 첨가에 따른 Cr-Si-O-N 박막의 미세 구조 변화와 기계적 특성의 변화를 체계적으로 연 구하였다.

2. 실험방법

2.1 박막의 제조

본 논문에서는 4성분계 Cr-Si-O-N 박막을 아크 이온 플레이팅(AIP; arc ion plating)과 스퍼터링 (sputtering)법을 혼합한 하이브리드 코팅 시스템 (Hybrid Coating System)을 사용하여 AISI 304와 실리콘 웨이퍼 위에 증착하였다. Cr-Si-O-N 박막의 증착을 위하여 Cr (99.99%) 타겟을 장착한 arc cathode gun과 Si (99.99%) 타겟을 장착한 sputter gun을 챔버의 각 벽면에 설치하였으며 두 gun 사 이에 회전이 가능한 수직 시편 지지대(holder)를 위 치시켰으며 25 rpm의 속도로 회전한다. 증착 시, Ar(99.999%) 가스는 Si sputter 타겟 근처로 직접 유 입하였고. O₂ (99.999%)와 N₂ (99.999%)가 혼합된 가스는 시편지지대 근처로 유입하였으며, 증착온도 는 300°C로 고정하였다. 기판 표면의 불순물 제거 를 위하여, 먼저 Si 웨이퍼와 경면으로 잘 연마된 SUS 304 기판을 20분간 아세톤 및 알코올로 초음 파 세정하였다. 가스 분압(O₂/(O₂+N₂))을 변화시키 고 스퍼터와 아크 전류를 각각 1.2 A와 50 A로 고 정시켰다. 본 연구의 Cr-Si-O-N 코팅막의 증착 조 건을 표 1에 나타내었다.

Table 1. Typical	deposition	condition	of	Cr-Si-O-N
coatings	by hybrid s	ystem		

Base pressure	4.0×10^{-5} torr		
Working pressure	2.0×10^{-3} torr		
	N ₂ :Ar	20:50 (sccm)	
	N ₂ :Ar:O ₂	18:50:2 (sccm)	
Working gas ratio	N ₂ :Ar:O ₂	16:50:4 (sccm)	
	N ₂ :Ar:O ₂	14:50:6 (sccm)	
	N ₂ :Ar:O ₂	12:50:8 (sccm)	
Substrate temperature	300°C		
Arc current for Cr source	50 A		
Sputter currents for Si source	1.2A		
Deposition time	80 min		
Thickness	2.5~3.0 μm		

2.2 박막의 물성측정

Cr-Si-O-N 코팅막의 두께는 단차 두께 측정기(α-STEP)로 측정하였고 박막의 화학 조성비는 전자 탐 침 미량 분석기(Electron Probe Micro-Analyzer, Shimadzu, EPMA 1600)로 측정하였다. 코팅막의 결정성은 Cu-Kα(25 kV, 10 mA)선을 이용한 X선 회절분석법(X-ray Diffractometer, Bruker, D8 ADVANCE)으로 분석하였고 Bragg's 법칙과 Scherrer 공식을 이용하여 면간거리와 평균 결정립 크기를 계산하였다.22,23) 박막의 화학적 결합상태를 확인하 기 위해 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy, Scientifics ESCALAB250)를 이용하였 다. 박막의 미세 경도는 25 g의 하중에서 Knoop indenter(Matsuzawa, MMT-7)를 가진 미세경도기를 이용하여 측정하였으며, 내마모 시험은 SiC ball(직 경 5.95 mm, 평균강도 22 GPa)을 상대재(counterpart material)로 하여 5 N의 수직하중과 0.1 m/s의 sliding speed의 조건으로, 약 25~28℃의 온도와 35~40%의 상대습도의 분위기에서 행해졌다.

3. 결과 및 고찰

그림 1은 Cr과 Si의 전류를 50 A, 1.2 A로 고정시 키고 산소의 유량을 변화시키며 합성한 Cr-Si-O-N 박막내의 Cr, Si, O, N의 조성변화를 나타낸다. Cr-Si-O-N 박막내의 산소 함량은 0에서 28.8 at.%까지 증가하였으나 N의 함량은 39.9 at.%에서 13.5 at.% 로 감소하였다. 반면 코팅막내의 Cr, Si 함량은 산 소의 함량 증가에 상관없이 55, 3 at.%로 변화없이 일정하게 유지됨을 볼 수 있었다.



Fig. 1. Compositional changes of Cr, Si, O and O content in the coating as a function of O content at a fixed Si sputter current of 1.2 A and Cr arc current of 50 A.



Fig. 2. X-ray diffraction patterns of Cr-Si-O-N coating as a function of O content.

그림 2는 산소함량에 따른 Cr-Si-O-N 박막의 XRD 회절패턴을 나타낸다. Cr-Si-N 박막의 회절패 턴은 (111), (200), (220)의 다배향성을 가지는 CrN 결정으로 성장했음을 알 수 있었다.¹⁷⁾ Cr-Si-N 박막 에 O 함량이 증가되면 CrN 결정이 200면으로 주 성장함을 알 수 있었으며 피크의 위치가 고각으로 이동함을 볼 수 있었다. 동시에 피크의 폭이 넓어 지는 퍼짐 현상을 나타내었다. 일반적으로 XRD 피 크의 퍼짐 현상은 결정입자 크기의 감소와 결정내 의 뷸균일(non-uniform)한 잔류응력의 존재 때문에 일어난다고 알려져 있다.¹⁸⁻²⁰⁾ Cr-Si-O-N 박막에서 산소가 첨가됨에 따라 피크가 고각으로 이동하는 현상은 상대적으로 작은 크기의 산소가 질소와 치 환고용 되어 나타난 현상으로 생각된다. 또한 산소 가 첨가됨에 의해 rombohedral 구조의 Cr₂O₃ 결정 이 생성됨을 알 수 있었고 산소함량 증가함에 따라 Cr₂O₃ 결정 피크가 감소하고 28.8 at.% 이상에서 Cr₂O₃ 결정 피크가 사라짐을 확인할 수 있었다. 그 리고 Cr, Cr₂N, CrSi₂, Si₃N₄ 등의 다른 회절 피크는 관찰되지 않았다.18-20)

그림 3은 산소함량에 따른 CrN(200)면의 d₂₀₀ 값 을 나타낸다. Cr-Si-N 박막에 산소가 첨가되면 d₂₀₀ 값은 감소하고 산소함량 24.8 at.%일 때 가장 작은 d₂₀₀ 값을 나타낸다. 이는 산소가 첨가되면 상대적으 로 작은 산소 원자가 질소 원자와 치환 고용이 일 어나 d₂₀₀ 값이 감소한다. Cr-Si-O-N 박막에서 산소 의 고용 한계는 대략 24.8 at.%이고 그 이상의 산소 가 첨가되더라도 더 이상 감소하지 않는다. 이것은 결정립이 나노 크기로 감소할 때의 격자상수의 감 소와 관련 있다.²¹⁾

그림 4는 Cr-Si-O-N 박막의 평균 결정립 크기를



Fig. 3. Interplaner distance of (200) crystal plane as a function of O content.



Fig. 4. The average grain size of Cr-Si-O-N coatings as a function of O content.

나타내고 Bragg's 법칙과 Scherrer 공식을 이용하여 계산하였다.^{22,23)} 산소가 증가할수록 평균 결정립 크 기는 40 nm에서 65 nm로 증가하였고 산소함량 12.0 at%에서 가장 좋은 결정성을 보였다. 하지만 산소함량 12.0 at% 이상에서는 평균 결정립 크기가 65~42 nm로 다시 감소하였다. 이는 Cr-Si-O-N 박막 에서 산소의 함량이 증가 할수록 비정질상의 양이 증가하여 결정 사이에 비정질이 파고들어 결정립의 분리가 일어나는 것과 관련 있다.²⁴⁾

그림 5는 Cr-Si-O(28.8 at.%)-N 박막의 Si2p, O1s 의 결합에너지를 나타낸다. 그림 5(a)는 Si2p의 결 합에너지로써 101.8 eV의 값을 나타내고 이것은 비 정질 Si₃N₄와 일치한다.²⁵⁾ 그리고 100.3 eV를 나타 내는 다른 피크는 SiNx상의 결합에너지와 일치한 다.²⁶⁾ 이 결과는 Cr-Si-O(28.8 at.%)-N 박막에서



Fig. 5. XPS spectra near the binding energies (a) O1s of and (b) Si2p for Cr-Si-O(28.8 at.%)-N coating.

Si₃N₄, SiNx 상은 비정질 상태로 존재함을 나타낸 다. 그림 5(b)는 Ols의 결합에너지를 보여주고 530.3 eV와 531.5 eV를 나태 내는데 이것은 Cr₂O₃ 상과 Cr의 위상선과 일치한다.^{27,28)} 이 결과는 Cr-Si-O-N 박막내의 산소함량이 24.8 at.% 이상 증가하면 Cr₂O₃ 상이 결정상에서 비정질상으로 변함을 의미 한다.

그림 6은 산소함량의 증가에 따른 Cr-Si-O-N 박 막의 미세경도를 나타낸다. Cr-Si-N 박막의 경도는 2000 HK 값을 가졌고 Cr-Si-O-N 박막내의 산소함 량을 19.4 at.%까지 증가시켰을 때 가장 높은 4507 HK 값을 가졌다. 그리고 산소함량이 19.4 at.% 이상 증가시키면 점차적으로 감소함을 볼 수 있었 다. 산소함량 19.4 at.%에서 가장 높은 미세 경도값 을 가졌고 이는 S. Veprek에 의해 설명된 입계 강 화에 의해 설명될 수 있다 즉, 입계 강화는 결정과 비정질 사이의 계면의 강한 밀착에너지에 의해 발 생하고 입계의 미끄러짐을 억제시킨다.²⁹⁾ 또한 Hall-



Fig. 6. Microhardness of Cr-Si-O-N coatings as a function O content.



Fig. 7. Friction coefficients of Cr-Si-O-N coatings against a sic ball.

Petch 식에 의한 결정립 미세화에 의한 강화이다.³⁰⁾ 반면, 산소함량 19.4 at.% 이상에서 미세경도가 다 시 점차적으로 감소한다. 이 결과는 박막내에 존재 하는 결정보다 상대적으로 부드러운 비정질의 양이 증가로 인하여 낮아진 것으로 생각된다. 나노복합 체 코팅막내의 비정질상의 부피비가 증가하면 결정 질과 비정질간의 이상적인 상호작용이 상실되며, 나 노 복합체의 경도는 비정질상의 특성에 더 의존적 으로 바뀌게 된다.³¹⁾

그림 7은 산소함량에 따른 Cr-Si-O-N 박막의 평 균 마찰계수를 나타낸다. Cr-Si-O-N 박막내의 산소 함량이 증가할수록 평균 마찰계수는 0.37에서 0.25 로 점차적으로 감소한다. 이 결과는 Cr-Si-O-N 박 막내의 산소함량이 증가할수록 상대적으로 부드러 운 비정질의 양이 증가하기 때문이라 생각된다. 그 리고 Cr₂O₃는 우수한 내마모성과 낮은 마찰계수 값 을 가진다고 보고되고 있다.^{32,33}

4. 결 론

4성분계 Cr-Si-O-N 박막을 아크 이온 플레이팅 (AIP; arc ion plating)과 스퍼터링(sputtering)법을 혼 합한 하이브리드 코팅 시스템(Hybrid Coating System)을 사용하여 AISI 304와 실리콘 웨이퍼 위 에 증착 하였다. 박막내의 산소함량이 박막의 미세 구조와 기계적 성질에 중요한 역할을 하는 것을 알 수 있었다. XRD와 XPS, 마모 테스트 결과 나노크 기의 결정과 비정질이 나노 복합체를 형성하고, 이 런 미세구조의 변화로 인하여 Cr-Si-O-N 박막의 미 세경도가 2000 HK에서 4507 HK로 변화하고 평균 마찰계수 값은 점점 줄어들어 0.25의 최소값을 가 진다.

후 기

본 연구는 과학기술부/한국과학재단 국가핵심 연 구센터사업(R15-2006-022-01002-0) 지원으로 수행 되었으며 이에 감사 드립니다.

참고문헌

- C. Rebholz, H. Ziegele, A. Leyland, A. Matthew, Surf. Coat. Technol. 115 (1999) 222.
- J. Creus, H. Idriss, H. Mazille, F. Sanchette, P. Jacquot, Surf. Coat. Technol. 107 (1998) 183.
- P. H. Mayrhofer, H. Willmann, C. Mitterer, Surf. Coat. Technol. 146-147 (2001) 222.
- B. Navinsek, P. Panjan, I. Mirosev, Surf. Coat. Technol. 97 (1997) 182.
- B. Navinsek, P. Panjan, Surf. Coat. Technol. 74-75 (1995) 919.
- D. H. Jung, J. H. Joo, Surf. Coat. Technol. 169-170 (2003) 424.
- J. J. Nainamparampil, J. S. Zavinski, A. Koreniy-Both, Thin Solid Films 333 (1998) 88.
- 8. S. Ulrich, S. Sattel, Thin Solid Films 437 (2003) 164.
- J. Vetter, E. Lugshider, S. S. Guerreiro. Surf. Coat. Technol. 98 (1998) 1233.
- J. Almer, M. Aasek, M. Oden, G. Hakansson, Thin Solid Films 385 (2001) 190.
- 11. B. Rother, H. Kappl, Surf. Coat. Technol. 96 (1997) 163.
- 12. S. H. Yao, Y. L. Su, Wear 212 (1997) 85.
- 13. Y. Wu, X. Wu, G. Li, G. Li, International Journal

of Refractory Metals & Hard Materials 26 (2008) 461.

- H. C. Barshilia, K. S. Rajam, Appl. Surf. Sci. 255 (2008) 2925.
- W. Y. Ho, D. H. Huang, L. T. Huang, C. H. Hsu, D. Y. Wang, Surf. Coat. Technol. 177-178 (2004) 172.
- F. Esaka, K. Furuya, H. Shimada, M. Imamura, N. Matsubayashi, H. Sato, A. Nishijima, A. Kawana, H. Ichimura, T. Kikuchi, J. Vac. Sci. Technol., A. Vac. Surf. Films 15 (1997) 2521.
- J. H. Park, W. S. Chung, Y. R. Cho, K. H. Kim, Surf. Coat. Technol. 188-189 (2004) 425.
- J. W. Kim, K. H. Kim, D. B. Lee, J. J. Moore, Surf. Coat. Technol. 200 (2006) 6702.
- M. Diserens, J. Patscheider, F. Levy, Surf. Coat. Technol. 108 (1998) 241.
- B. D. Cullity, in Elements of X-ray Diffraction, 2nd ed. (Addison-Wesley Massachusetts, 1978), pp.101-103, 288.
- J. Prochazaka, P. Karvankovam, M. G. J. Veprek-Heijman, S. Veprek, Mater. Sci. Mater. A 384 (2004) 102.
- 22. M. H. Lee, K. H. Kim, J. Vac. Sci. Technol., A 21(4) (2003) 895.
- A. Jung, H. Natter, R. Hempelmann, E. Lach, J. Master. Sci., 44 (2009) 2725.
- 24. S. H. Kim, J. K. Kim, K. H. Kim, Thin Solid Films 420 (2002) 360.
- J. F. Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomben, Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy, Physical Electronics, Inc., Minnesota, (1995) 238.
- I. Biczó, V. K. Josepovits, F. Pavlyák, J. Giber, Appl. Surf. Sci., 65-66 (1993) 157.
- 27. P. Marcus, J. M. Grimal, Corrosion Science, 33, (1992) 805.
- S. Agouram, F. Bodart, G. Terwagne Surf. Coat. Technology, 180-181 (2004) 164.
- S. Veprek, J. Vac. Sci. Technol., A, Vac. Surf. Films 17 (1999) 2401.
- A. Lasalmonie, J. L. Strudel, J. Master. Sci. 21 (1986) 1837.
- J. Patscheider, T. Zehnder, M. Diserens, Surf. Coat. Technol. 146 (2001) 201.
- 32. B. S. Mann, B. Prakash, Wear. 240(1-2) (2000) 223.
- H. Liu, J. Tao, J. Xu, Z. Chen, Q. Gao, Surf. Coat. Technol. 204 (2009) 28.